

掺氟汞系 1223 相的结构与超导电性

高孝恢 李洁
(中南工业大学化学系,长沙 410083)

肖慎修 陈天朗
(四川联合大学化学系,成都 610064)

摘要 合成了掺氟汞基铜酸盐超导体。研究证明氟进入了 1223 相,占据元胞中 O(3) 的晶格位置。掺氟烧结而不退火样品的超导临界温度 T_c 为 133.8 K,比不掺氟烧结标准样品的 T_c 提高约 22 K,显示氟掺杂能够使样品中载流子浓度 n_h 不经退火一步接近最佳值。F 代 O(3) 收缩了 CuO₂ 面与电荷储存层间距离及氟的电负性比氧大是提高 T_c 的主要原因。

关键词: 汞基氧氟铜酸盐, 类钙钛矿结构, 超导电性, 掺杂

学科代码: B030101, B031100

Bednorz 与 Muller^[1]用 Ba 替代绝缘性 La₂CuO₄ 中的 La,发现类钙钛矿铜酸盐高温超导现象,成为科学史上重要篇章。现在已经公认,铜酸盐钙钛矿的超导电性发生在晶体中的 CuO₂ 层上。每种铜酸盐最高超导临界温度 T_c 值,对应着 CuO₂ 层上一个最佳载流子浓度 n_h ,而 n_h 值的变化,与 CuO₂ 层内价键和(BVS)的变化直接相关^[2]。对于空穴型超导体,顶氧的晶体化学性质具有关键作用^[3],它决定 CuO₂ 层与储存层间载流子的迁移能力。它们之间的这种相互关联,构成了铜酸盐高温超导体中定性的唯象电荷转移模型。因此,对顶氧的深入研究,为进一步了解超导机理,乃至高温超导体的化学设计,具有十分重要的意义。

研究顶氧作用的工作虽然很多,但是用掺杂原子替代顶氧,研究其对超导电性的影响报导很少。我们认为,选择一些有不同半径或不同价电子数的元素替代顶氧,将能更好显示顶氧在超导中的作用。氟与氧的半径比较接近,但前者多一个价电子,如果在制备氧氟铜酸盐中使氟能替代顶氧,将为研究顶氧的作用提供一种较好的途径。

我们曾研究了 R(Y,Re)-123^[4], Bi-2223^[5] 及 Pb-3212^[6] 的氧氟铜酸盐超导体,发现其中氟总是替代了顶氧,并使上述三个体系的超导性有不同程度的改善。本文试图通过掺氟 Hg 基超导体的制备,研究其中掺杂阴离子 F 所占晶格位置,及其引起超导性变化的机理。

1 实验与结果

1998-11-05 收到初稿, 1999-01-28 收到修改稿。联系人:高孝恢。

1.1 样品的制备

根据按名义成份 $\text{HgBa}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_8$ (记为**(A)**) , 及 $\text{Hg}_{1.05}\text{Ba}_2\text{Ca}_{2.1}\text{Cu}_{3.18}\text{O}_{8.25}\text{F}_{0.4}$ (记为**(B)**) , 分别取高纯的 HgO , BaO , CaO , CuO 和 HgO , BaO , CaO , CuO 与 CuF_2 在充满 N_2 气的干燥箱中进行充分混合 , 把混合后的粉末压制成 $18 \text{ mm} \times 6 \text{ mm} \times 2 \text{ mm}$ 的长条状. 样品封入真空 ($\sim 1.3 \text{ Pa}$) 的石英管中 , 在管式炉中以 $600 \text{ }^{\circ}\text{C h}^{-1}$ 速率升温至 $880 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 烧结 8h , 自然冷却至室温. 放置未掺氟的标准样品(**A**)的石英管内发现有一些小汞珠. 掺氟样品(**B**)的石英管内 , 没有汞珠出现.

1.2 氟含量的测定

用离子选择电极法 , 测量掺氟样品烧结后尚存的氟. 结果显示 , 氟在样品名义成分中的计量数高达 0.3884.

1.3 超导性

两类烧结而不退火样品的零电阻温度 T_{c0} 由四极法测定(图 1). 样品(**A**)的 $R-T$ 曲线(a)有严重拖尾现象 , 它的零电阻温度 $T_{c0} = 92 \text{ K}$. 样品(**B**)的 $R-T$ 曲线(b)转变宽度较窄 , $T_{c0} = 132.6 \text{ K}$. 把两类样品于氧气中 $350 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 退火 8h , 其 T 均为 135 K ,但是退火后的(**A**)、(**B**)样品的 T_{c0} 分别为 132.6 K 及 133.8 K . 样品(**A**)与样品(**B**)的超导性分别由交流磁化率确定(图 2(a)、(b)). 对样品(**A**) , $T_{c0} = 111.6 \text{ K}$,而样品(**B**)的 $T_{c0} = 133.8 \text{ K}$,与文献^[7,8]合成掺氟样品的结果非常接近.

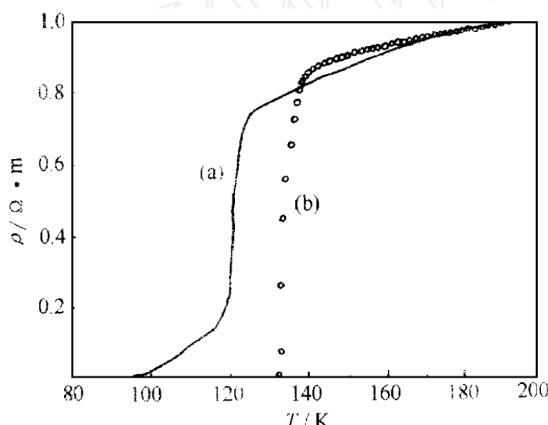


图 1 不掺氟样品(**A**)与掺氟样品(**B**)烧结不退火的 $\rho-T$ 曲线

Fig. 1 $\rho-T$ curves of sample (A) (a) and F doped sample (B) (b) without annealing

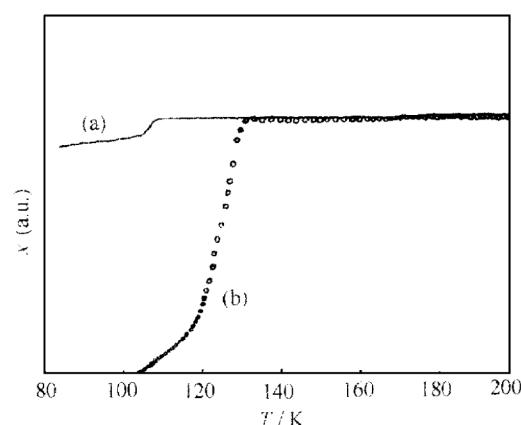


图 2 不掺氟样品(**A**)与掺氟样品(**B**)烧结不退火的磁化曲线

Fig. 2 Magnetization curves of sample (A) (a) and F doped sample (B) (b) without annealing

1.4 X射线衍射分析的结果

在氧气中 $350 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 退火 8h 两类样品的 X 射线粉末衍射 , 在 Siemens D-500 衍射仪上完成. 操作条件为 $\text{Cu } K_{\alpha}$, 35 kV , 20 mA , 2θ 为 4° - 60° , 步宽为 0.05° . 不掺氟与掺氟样品的轮廓甚为一致. 模拟计算得样品(**A**)的晶格常数为 $a = 3.849 \text{ \AA}$, $c = 15.835 \text{ \AA}$,它们与文献^[8]的 $a = 3.852 \text{ \AA}$, $c = 15.830 \text{ \AA}$ 颇为一致 , 样品 (**B**) 的晶格常数是 $a = 3.841 \text{ \AA}$, $c = 15.812 \text{ \AA}$. 即用氟替代部分氧之后 , 元胞体积有一定的收缩. 两类样品都存在一定杂相 , 它们主要是 CaHgO_2 及 BaCuO_2 . 掺氟样品中杂相体积显著低于不掺氟的. 根据X射线粉末衍射的结果计算得 , 样品

(A) 含 1223 相的体积分数为 70 %, 样品(B) 中的 1223 相大于 85 %.

1.5 X 射线光电子能谱

所有测量在 VG ESCA MK II 仪器上进行, 采用 Mg $K\alpha$ 射线源, 室温测量, 真空度为 10^{-6} - 10^{-7} Pa, 结合能测量误差 $\leq \pm 0.1$ eV. 分别测定 Hg 4f, Ba 3d, Ca 2p, Cu 2p 及 F 1s 的光电子能谱, 图 3 给出了 Hg 的 XPS 谱图. 表 1 中列出了(A)、(B) 两类样品中各元素的光电子束缚能. 由表可见, 掺氟与不掺氟样品比较, 其中 Ca 2p 及 Cu 2p 的光电子谱基本相同, 而掺氟样品的 Hg 4f 及 Ba 3d 的光电子谱明显向高能方向发生位移.

1.6 Raman 光谱

Raman 谱利用一个 Spex 1403 的双单色光学系统, 514.5 nm 氦离子激光辐射源, 硅二极系统检测器, 光谱由多次运行求平均.

在氧气中退火的样品(A)及样品(B)的 Raman 谱如图 4 所示. 由该图可见, 样品(B)比样品(A)在 532 cm^{-1} 处多出一个峰. 来自杂相 CaHgO_2 的 240 cm^{-1} 和 670 cm^{-1} 两个散射峰明显可见. 此外, 332 cm^{-1} 处的强峰属于 HgO 杂质散射的结果. 样品(A)在 582 cm^{-1} 处存在一个宽化峰, 它属于 O(3) 原子的 A_{1g} 散射. 在样品(B)中, 于 602 cm^{-1} 处有一个更明显的宽化峰.

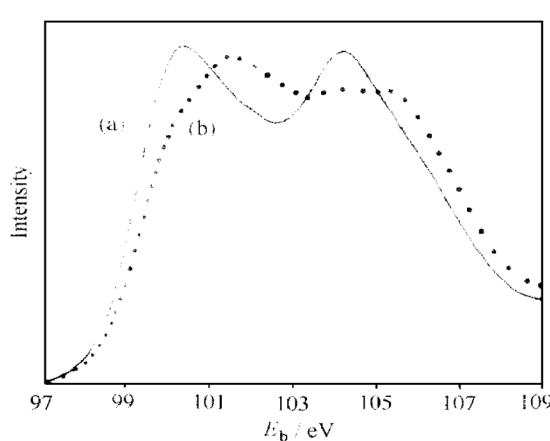


图 3 不掺氟与掺氟样品 Hg4f 光电子能谱

Fig. 3 XPS of Hg4f in F-undoped
(a) and F-doped (b) samples

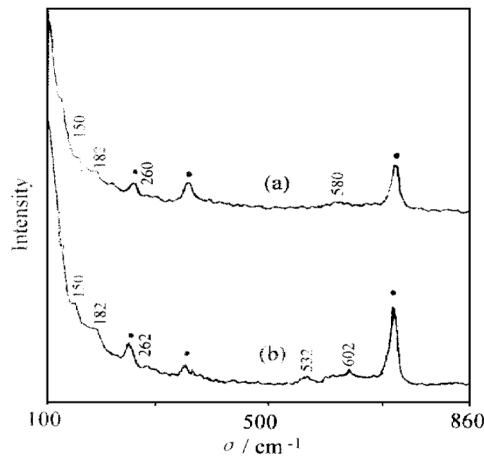


图 4 不掺氟与掺氟样品的 Raman 散射谱

Fig. 4 Raman spectra of the samples
F-undoped (a) and F-doped (b)

2 讨论

2.1 氟是否进入超导相

考察 X 射线分析的结果, 不掺氟样品形成 1223 相的体积分数约为 70 %, 而掺氟样品大于 85 %. 这种结果不仅显示掺氟有益于 1223 相的形成, 同时意味着氟进入了 1223 相. 特别是掺氟烧结而不退火样品的 T_c 总是比不掺氟样品的 T_c 有大幅度改善, 充分体现了氟进入了超导相.

2.2 氟在晶格中的占位

弄清氟处于 1223 超导相元胞中何种晶格位置, 对于了解超导性与晶体化学间的关系十分重要. X 射线结果显示, 掺氟样品中元胞 c 轴收缩明显, $a = b$ 轴变化很小, 这暗示 F 可能进入 c 轴某种氧的晶格位置.

表 1 Hg, Ba, Ca, Cu 及 F 的光电子束缚能(eV)

Table 1 The binding energy of Hg, Ba, Ca, Cu and F respectively

State of the elements	Hg4f ^{7/2}	Ba3d ^{5/2}	Ca2p ^{3/2}	Cu2p ^{3/2}	Fls
Standard sample (A)	100.8	779.7	346.0	933.0	-
F-doped sample(B)	101.4	780.0	346.1	933.2	684.3

表 2 Hg-Ba-Ca-Cu-(O, F)体系中的键能(kJ · mol⁻¹)

Table 2 The chemical bond energy of the bonds in Hg-Ba-Ca-Cu-(O, F)

Chemical bond	M - O	Hg - O	Ba - O	Ca - O	Cu - O
Decomposition energy	D(M - O)	374.0 ^c	561 ^c	460 ^c	593 ^c
Chemical bond	M - F	Hg - F	Ba - F	Ca - F	Cu - F
Decomposition energy	D(M - F)	599	578 ^e	550	803 ^e

Notes: "c" represents the calculated value by Pauling formula [9]; "e", the experimental result from reference [10].

根据固相化学反应原理,形成的晶体应处于热力学稳定状态,其中阴阳离子配位形成的化学键最稳定。因此,在Hg²⁺,Ca²⁺,Ba²⁺,Cu²⁺,O²⁻及F⁻的混合体系中,其金属氧化物或氟化物的单键能,可以作为成键的判据。表2列出了Hg-Ba-Ca-Cu-(O,F)的M-O,M-F键的分解能D(M-(O,F))。对比其中D(M-O)及D(M-F)可见,形成M-F键比形成M-O键对体系更有利。但由于体系中F的含量不宜太大,综合考虑到热力学效应及元胞结构,如果F代CuO₅四方锥体中的顶氧—O(3),它将同时与Hg、Ba、Cu形成配位键,使体系处于热力学稳定状态。

一般说来,F比O具有更大的吸引电子的能力,如果它替代某金属元素的配位氧,则该金属元素的束缚能增加。表1中的XPS测量的束缚能显示,Hg4f的光电子能增加0.60 eV,Ba3d光电子能增加0.35 eV。这说明F替代了O(3),直接与Hg及Ba配位成键。此外,Cu2p^{3/2}略有增加,Ca2p^{3/2}能量未变的结果,进一步证明F占据了O(3)的晶格位置。

Raman光谱的结果显示,不掺氟的标准样品Raman散射与文献^[11]颇为一致,各峰的归属也与该文献所指出的相同。要着重指出的是,文献提出的582 cm⁻¹峰属于顶氧c轴方向的振动,其肩峰570 cm⁻¹是插入氧的振动。本实验中所制备样品(B)的602 cm⁻¹宽化峰(见图4中曲线(b)),是由于插入氧、顶氧及顶氧被氟替代(产生不同的力常数及约合质量)振动综合所产生的结果。532 cm⁻¹峰可能来自F代O(3)的E_g扭曲振动。总之,Raman散射结果也显示F替代了顶氧。

上述研究结果说明,样品(B)为氧氟钙钛矿化合物,其中氟占据了元胞中CuO₅四方锥中顶氧的位置,如图5所示。实际上,在Re(Y)-123体系,Bi-2223系Pb-3212系中,F都是取代CuO₅中顶氧^[4-6]。考虑到这些实验结果和热力学的要求,可以推断元胞中CuO₅的顶氧是F的优化占领晶格位置。因此,对于空穴型超导体,掺氟可以作为研究CuO₅四方锥中顶氧对超导性影响的一种方法。

2.3 氟代顶端氧对超导性的影响

HgBa₂Ca₂Cu₃O_{8+δ}的超导性,与非计量氧δ密切相关。如果δ=0,该化合物属于空穴型载流子过低掺杂,对于1223-Hg系,优化的载流子浓度为n_h~0.32/每CuO₂面单位。

按化学计量组份封入到真空石英管中制备的样品如果不退火,其中δ必定为零。测得这

种样品的 $T_c = 111.5$ K, 它远未达到最大 T_c 值, 显然这是因为氧含量过低导致载流子浓度未达最佳值。所以, 当把该样品于氧气中 350 °C 退火 8 h, 测得该样品的 $T_c = 135$ K。然而, 掺氟烧结而不退火的样品, 测得其 $T_c = 133.8$ K。把该类样品在氧气中作相当于不掺氟样品的退火手续, 则测得其 T_c 仅略为上升, 说明掺氟不退火样品的载流子浓度, 已非常接近最佳值。这种实验结果充分表明, 氟有比氧更强的移出 CuO_2 层上电子的能力, 这与氟的电负性大于氧相吻合。同时, 该事实还显示, 在体系中掺适量的氟, 可以替代在氧气中退火的过程。

文献^[11]指出, Hg -基铜酸盐超导体中 CuO_5 的顶氧与 CuO_2 面间距, 对电荷迁离 CuO_2 层很敏感。前面的 X 射线结果指出, 掺氟体系元胞的 c 轴, 比不掺氟的标准样品的明显收缩。根据远程影响可以忽略的原则, c 轴收缩归咎于氟替代氧拉近了电荷储存层与导电层, 于是使 CuO_2 面上的电荷易于向电荷储存层转移, 提高了 CuO_2 面上的载流子浓度, 有利于超导性。因此, 掺氟使载流子浓度接近最佳值, 来源于氟吸引电子能力大于氧, 及缩短电荷储存层与 $\text{Cu}-\text{O}$ 层间距离的结果。由此可以得到一个推理, 如果能找到吸引电子能力比氧大, 拉近载流子层与电荷储存层的能力比氧强的元素或基团替代顶氧, 将可能改善超导电性。这为寻找更高 T_c 的超导材料化学设计, 提供了有意义的线索。

3 结论

(1) 合成了 1223- Hg 基氟铜酸盐类钙钛矿超导体, 氟进入了 1223 相, 并促成该相的形成。指认了氟代替元胞中 O(3) 而占据了 CuO_5 锥体中顶氧的晶格位置。

(2) 氟吸引电子能力大于氧, 以及氟拉近了电荷储存层与 CuO_2 层距离, 使元胞中 CuO_2 面上载流子浓度非常接近最佳值, 是掺氟样品的 T_c 明显提高的主要原因。

参 考 文 献

- 1 Bednorz J G, Muller A. Z. Phys., 1986, B64: 189; Mod. Phys. Rev., 1988, 60: 585
- 2 Whangbo M H, Torardi C C, et al. Science, 1990, 249: 1143
- 3 Ohta Y, Tohyama T, Maekawa S, et al. Phys. Rev. B, 1991, 43: 2968
- 4 Li Haiping, Cao Xiaohui. Acta Physica Sinica, 1992, 41: 851; 李海屏, 高孝恢. 物理学报 (Wuli Xuebao), 1992, 41: 851
- 5 Gao X H, Jiang S F, Li J, et al. Phys. Rev. B, 1994, 46: 1237
- 6 Gao De, Jiang Shufeng, Gao Xiaohui, et al. Chinese Journal of Low Temperature Physics, 1997, 19: 68; 高德, 蒋淑芬, 高孝恢等. 低温物理学报 (Diwen Wuli Xuebao), 1997, 19: 68

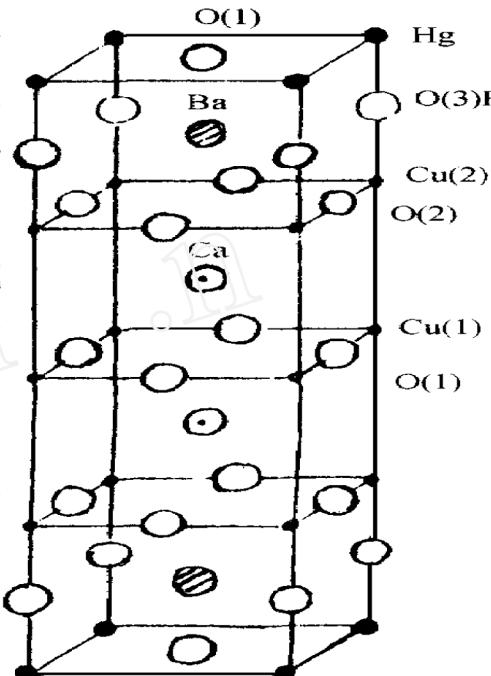


图 5 氟在 1223 相元胞中所占晶格位置

Fig. 5 The lattice site of F in 1223 phase

- 7 Zhao Zh X , Zhu W J , et al. *Physica C*, **1994**, *228*:235
- 8 Wang Y T , Hermana A M , et al. *Physica C*, **1995**, *229* : 254
- 9 Paranthaman M. *Physica C*, **1994** , *228* : 222
- 10 Pauling L. *The Nature of Chemical Bond*. Cornell Univ. Press , 1960 ,75p
- 11 Ren Y T , Chang H , et al. *Physica C*, **1993** , *227* : 273

Structure and Superconductivity of 1223 Phase in F-doped Hg-based Superconductor

Gao Xiaohui Li Jie

(Department of Chemistry, Central South University of Technology, Changsha 410083)

Xiao Shenxiu Chen Tianlang

(Department of Chemistry, Sichuan United University , Chengdu 610064)

Abstract 1223 Hg-based Hg-Ba-Ca-Cu-(O,F) superconductor was prepared. It was proved that F entered 1223 superconductive phase and located at O(3) lattice site. The critical temperature T_c of the samples doped with fluoride but without annealing is as high as 133.8 K, which is ~ 22 K higher than that of Hg-Ba-Ca-Cu-O standard samples. With the substitution of F with O, the carrier's concentration in the superconductor is nearly close to the optimum value , which leads T_c of F-doped samples increasing greatly.

Keywords: 1223 Hg-based superconductor , Quasi-perovskite structure , Superconductivity , Doping-fluoride